

# Analyse quantitative par diffraction RX sur poudres

## **Programme**

- Affinement de paramètres de maille
- Indexation ab-initio de diagrammes de poudre
- Affinement Rietveld
- Analyse microstructure: taille de grains/contraintes
- Analyse quantitative de mélanges de phases (rapport massique)
- Résolution structurale
- Mesures quantitatives au diffractomètre

## **Public concerné**

Enseignants, chercheurs, Ingénieurs, techniciens

## **Pré Requis**

Connaissance de base de la diffraction et de la cristallographie

Expérience de la pratique de la mesure souhaitée

## **Modalités pratiques**

Effectif : 12

Durée : 2x2 journées, espacées de 2 ou 3 semaines (Cours: 40% TP: 60%)

Lieu : Université de Montpellier II

Dates : 7-8 juin 2007 et 18-19 juin 2007

## **Responsable**

A. van der Lee (IEM) 04 67 14 91 35

F. Favier (LAMMI) 04 67 14 33 32